

本期封面



2001年4期

栏目:

DOI:

论文题目: 低辐射薄膜TiO₂-Ag-TiO₂-SiO₂的纳米尺度显微结构

作者姓名: 詹倩 于荣 贺连龙 李斗星 郭晓楠

工作单位: 中国科学院金属研究所固体原子像开放研究实验室, 沈阳110016

通信作者: 詹倩

通信作者Email: gqzhan@imr.ac.cn

文章摘要: 成功地制备了TiO₂-Ag-TiO₂-SiO₂超薄多层膜的截面样品, 并对其微观结构进行TEM, HREM及纳米束EDS分析. 结果表明, 薄膜各层厚度均匀, 界面明锐、光滑. Ag层由纳米晶组成, 而TiO₂和SiO₂层为非晶. Ag在膜层中没有扩散或聚团, 这也正是保证整个薄膜性能指标的一个重要因素.

关键词: 低辐射薄膜, 微观结构, HREM, 纳米束分析

分类号: 0484. 1, TG115. 21

关闭